



SEM Scietex F12

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ
СКАНИРУЮЩИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ
МИКРОСКОП С АВТОЭМИССИОННЫМ
КАТОДОМ

SEM Scietex F12 обладает высокой производительностью за счет инноваций в технологии получения изображений и уникальных особенностей конструкции, при этом скорость визуализации превышает традиционные электронные микроскопы в десятки раз. В **SEM Scietex F12** применяются детекторы с прямым преобразованием электронов, которые помогают преодолевать ограничения обычных электронных микроскопов по скорости, точности и повреждению образца. Таким образом сканирующий электронный микроскоп превращается из традиционной nano-«фотокамеры» в nano-«видеокамеру». Области применения: науки о жизни, исследование материалов, полупроводниковая промышленность и геологические ресурсы.

- Быстрая визуализация
- Высокое качество изображения
- Кросс-масштабная визуализация образцов с большой площадью поверхности
- Интеллектуальный анализ
- Способность к круглосуточной автономной работе

Катод	Высокостабильный катод с полевой эмиссией типа Шоттки	Объективная линза	Электромагнитная с функцией замедления пучка (BD mode)
Разрешение	1.5 нм при 1 кВ 1.3 нм при 3 кВ	Рабочее расстояние	1,5 мм
Ускоряющее напряжение	0.1–12 кВ	Максимальное поле зрения	100 мкм - 1 мм
Увеличение	500X~600,000X (изображение SEM)	Столик	X=150 мм, Y=150 мм, Z=20 мм (5 кг)
Детекторы	In-column SE; In-lens BSE	Скорость съемки	SE и BSE - 100Мп/с
Ток пучка	50 пА – 30 нА		

